楕円鏡を用いた双方向反射率分布関数の高速計測

角野 皓平[†] 向川 康博[†] 八木 康史[†]

† 大阪大学 産業科学研究所

〒 567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1

E-mail: [†]{sumino,mukaigaw,yagi}@am.sanken.osaka-u.ac.jp

あらまし 物体表面の反射特性を表す双方向反射率分布関数を密に計測するためには,様々な角度から照明した場合 の反射光を様々な角度から計測する必要があるため,膨大な時間が必要であった.本研究では,楕円鏡とプロジェク タを組み合わせることで,高速に反射率を計測する手法を提案する.楕円鏡の一方の焦点に試料を配置し,もう一方 の焦点にカメラとプロジェクタをハーフミラーを用いて配置する.これにより,投影画像を変えるだけで光源方向を 自由に制御できる.また,試料のあらゆる角度への反射光は,カメラで一度に計測できるため,高速な反射率計測が 可能となる.実際に計測装置を試作し,異方性反射特性を持つベルベットとサテンの反射率を計測したところ,光源 のサンプリング間隔をそれぞれ1度とした場合でも,約50分で計測できた.

キーワード 楕円鏡, BRDF, 異方性反射

High Speed Measurement of BRDF using an Ellipsoidal Mirror

Kohei SUMINO[†], Yasuhiro MUKAIGAWA[†], and Yasushi YAGI[†]

† The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University 8-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka, 567-0047, Japan
E muil + (muine multiple mu

E-mail: †{sumino,mukaigaw,yagi}@am.sanken.osaka-u.ac.jp

Abstract BRDF (Bi-directional Reflectance Distribution Function) is used for representing properties of the surface reflectance. However, it requires huge amounts of time to densely measure BRDFs because the target object should be illuminated from all incident angles and the reflected lights should be measured from all reflected angles. In this paper, we present a high-speed method to measure BRDFs using an ellipsoidal mirror and a projector. The object is placed at a focal point, and a camera and a projector are placed at the other focal point using a half mirror. By using this setup, the illumination angle can be rapidly rotated by changing the projection pattern. Moreover, the omni-directional reflected lights from the object can be measured by one static camera at once. We have created a prototype measuring system. It requires about fifty minutes to measure BRDFs of velvet and satin which have an anisotropic reflection property, even if the sampling interval of the incident angle is one degree. **Key words** ellipsoidal mirror, BRDF, anisotropic reflection

1. はじめに

物体の幾何情報である3次元形状は,レンジファインダ等を 用いることによって比較的容易に計測できるようになってきた. 一方,光学情報である物体表面の反射特性は,未だに計測が容 易ではない.反射特性は,物体の表面の微視的構造に起因する 情報であり,単なる CG への利用だけでなく,文化遺産のアー カイブや物体認識など,様々な用途に応用可能な重要な情報で あるにも関わらず,簡便な計測方法が確立されていない.

これは,反射特性を表す双方向反射率分布関数 (BRDF) を完 全に計測するためには,対象物体に対してあらゆる方向から照 明したときの反射光を,あらゆる視線方向から観測しなければ ならず,膨大な計測時間と記憶容量が必要となることが大きな 理由である.そのため,従来は,BRDFをパラメトリックモデ ルで近似したり,物体表面上でBRDFが一様であると仮定す るなど,対象物体を限定して問題を簡単化することが多かった.

それに対して,本研究では対象物体を限定せず,反射光学系 を工夫することで,BRDFを密に計測するという問題に正面 から取り組む.カメラを回転させる代わりに楕円鏡を利用し, 光源を回転させる代わりにプロジェクタを利用する.提案手法 では,機械的な並進・回転機構を完全に排除することができ, BRDFを高速に計測することが可能となる. 反射特性を簡潔に記述するために, Phong モデル[1] や Torrance-Sparrow モデル[2] などのパラメトリックモデルが 広く利用されている.実物体の反射特性をこれらのパラメト リックモデルで表現するためには,パラメータ推定が必要とな る.佐藤ら[3]は,対象物体の3次元形状と実画像に基づいて, Torrance-Sparrow モデルのパラメータを推定する手法を提案 している.また,町田ら[4]は,反射モデルのパラメータ推定 のための,最適な光源位置を決定する手法を提案している.し かし,これらのパラメトリックモデルによる近似表現では,複 雑な反射特性を正確に表現することは難しいという問題がある.

一方,昨今の計算機の記憶容量の増大に伴って,反射特性を パラメトリックモデルで近似表現するのではなく,光源方向を 密に変化させた場合の見え方を,そのまま記録しておくノンパ ラメトリックモデルが主流になりつつある.光源方向を密に変 化させることができれば,複雑な反射特性でも原理的には誤差 なく記録することができる.Debevecらは,光源を回転させて, 顔の反射特性を計測するLight Stageを提案した[5].また,高 速度カメラとフラッシュを用いることで,計測時間を大幅に短 縮した[6].さらに,反射特性の計測が目的ではないが,回転 機構を排除し,ドーム状にLEDを配置して任意の照明環境を 模倣できる装置も提案している[7].しかし,これらの方法は, 光源方向を変えるだけであり,視線方向は固定されていた.

物体表面の BRDF を完全に計測するためには,光源だけで はなくカメラも物体を中心としてあらゆる方向に配置しなけれ ばならない.武田らは,光源とカメラを同時に回転できる装置 を用いて,サテンなどの異方性反射を持つ布の反射特性を計測 した[8].しかし,密にデータを計測するためには,光源方向と 観測方向のすべての組合せについて反射光の観測が必要である ため,膨大な計測時間が必要となる.

計測時間を劇的に短縮する方法として,反射鏡を用いたシス テムがいくつか提案されている.Ward [9] は,半球面のハーフ ミラーと魚眼レンズを用いることで,カメラを回転させずにす べての視線方向からの反射光を一度に観測できる装置を提案し た.しかし,光源はハーフミラーの裏側で回転させなければな らず,計測には時間がかかっていた.また,試料とカメラの両 方を半球の中心に配置できないため,中心付近に並べて配置し, この誤差を吸収するために,大きな半球が必要であった.一方, Dana [10] は,放物面鏡を用いることで,BRDF だけでなく双 方向テクスチャ関数(BTF)をも計測できる装置を開発してい る.しかし,光源の回転機構は排除できたものの,光源を平行 移動する機構は依然として必要である.また,計測できる光源 方向・視線方向の範囲は限定されており,あらゆる方向のデー タが計測できるわけではない.近年, Han ら [11] は, 万華鏡の ように平面鏡を組み合わせ,さらにプロジェクタを用いること で,機械的な回転・移動機構を完全に排除しつつ,BTF を計測 できるシステムを開発した.しかし,光源方向・視線方向は離 散的であり,密な計測ができるわけではない.

一方,本研究で提案する装置は,楕円鏡とプロジェクタを組



図 1 BRDF の 4 パラメータ

み合わせた BRDF 計測装置である.機械的な回転・移動機構 を完全に排除しているため,高速な計測が可能である.また, 光源方向と視線方向を密に変化させて BRDF を計測できるコ ンパクトな装置である.

3. 双方向反射率分布関数 (BRDF)

3.1 BRDF とは

双方向反射率分布関数 (BRDF: Bi-directional Reflectance Distribution Function) とは,図1に示すように,光源方向 (θ_i, ϕ_i) からの入射光照度に対する視点方向 (θ_r, ϕ_r) への反射 光輝度の比率を表す関数であり,物体表面の反射特性を表現で きる.BRDF は視点方向 (θ_r, ϕ_r) ,光源方向 (θ_i, ϕ_i) に加えて, 波長 (λ) にも依存するため,厳密には5パラメータの関数であ る.しかし,現実には各波長ごとの反射率を表現しても用途が 限られており,計測には分光器などの機材が必要となるため, 赤(R),緑(G),青(B)の3チャンネルごとに BRDF を定義 し,4パラメータの関数とするのが一般的である.

3.2 BRDF の記述

BRDF の記述方法は,パラメトリック表現とノンパラメト リックに大別できる.パラメトリック表現は,BRDF を数式に よって近似表現するものであり,従来より Phong [1], Torrance-Sparrow [2] などの反射モデルが用いられている.反射モデル を記述するためのデータ量が小さいことや,ハードウェアレン ダリングとの親和性が高いことから広く利用されているが,表 現能力には限界がある.

一方, ノンパラメトリック表現は, 各角度に対する反射率を 実データに基づいて記録しておく方式であり, 制約が極めて少 ないため様々な反射特性を表現できる.密にデータを記録する ためには大量のデータが必要となるが, 近年の HDD 容量の増 大化と高精度な CG 表現の必要性から, 主流になりつつある. 本研究では,表現能力を優先するために, ノンパラメトリック 表現によって BRDF を記述する.

3.3 等方性反射と異方性反射

光源と視点を固定し,法線方向を軸に物体を回転させたとき に見え方が変化しないものは等方性反射,変化するものは異方 性反射と呼ばれる.自然界の多くの物体は等方性反射と見なす ことができ,方位角については相対角度である($\phi_i + \phi_r$)で決ま ることから,BRDFを3パラメータで表現することができる. 一方,ヘアライン加工された金属や,ベルベットやサテンな どの織物は,その複雑な微細形状に起因して,法線方向を軸に 回転させただけでも見え方が大きく変化する異方性反射となる. 異方性反射をもつ物体を対象とすると,BRDFを4パラメー タで表現する必要がある.

BRDF のパラメータ数を 4 から 3 にできれば,計測時間や データ容量を大幅に削減できるために都合が良い.しかし,我々 の身近にある衣類などの布も異方性反射であることが多く,等 方性反射を仮定してしまうと表現能力が劇的に低下する恐れが ある.そこで,本研究では,あくまでも 4 パラメータで BRDF を表現し,ベルベットやサテンなどの織物の反射特性を完全に 計測することを目指す.

3.4 4パラメータ表現の問題点

前述の通り,4パラメータの BRDF で反射特性を計測し,その計測データを近似的な数式モデルを用いずに直接記録しておけば,表現能力は格段に向上する.しかし,実際にはデータ容量と計測時間の2つの大きな問題がある.

まず,データ容量の問題について考えてみる.例えば, $\theta_r, \phi_r, \theta_i, \phi_i$ のそれぞれを,1度刻みで変化させ,それぞれ の反射光を R,G,Bの 3byte で記録するとすれば,

 $360 \times 90 \times 360 \times 90 \times 3 = 3,149,280,000 byte$

と, 3GB もの大量データとなってしまう.以前は, このような 膨大なデータは非現実的と見なされてきたが, 近年の HDD の 大容量化により, さほど非現実的な容量ではなくなってきた. さらに, このデータ量は非圧縮時の容量であり, BRDF は冗長 性が高いことから, 劇的な圧縮が可能であると予想される.そ のため, データ容量の問題については, 非現実的な問題ではな くなってきている.

一方,計測時間の問題は深刻である.計測に時間がかかるの は,光源位置を2パラメータずつ移動させ,それぞれの光源位 置でカメラを2パラメータずつ移動させる必要があり,全体と して膨大な組み合わせとなるからである.もしカメラと光源を 1度刻みで移動させ,反射光を計測するのに必要な時間が仮に 1秒であったとしても,

 $1sec \times 360 \times 90 \times 360 \times 90 = 1,049,760,000sec \simeq 33 years$

という途方もない非現実的な時間がかかってしまう.各角度ご とにカメラ止めずに,カメラを高速回転させながら動画として 撮影するなどの工夫をすれば数十倍は高速化ができるが,依然 として膨大な計測時間であることには変わりない.この計測時 間の問題は,計算機の性能が向上しても改善の見込みはない.

このように,データ量の問題はさほど大きな問題ではない が,計測時間の問題は大いに検討の余地がある.今まで,4パ ラメータの BRDF を完全に計測しようという研究があまりな されていなかったのは,この計測時間の問題が大きいのではな いだろうか.本研究では,この計測時間の問題に対して正面か ら取り組み,反射光学系を工夫することで高速化する.



4. 楕円鏡を用いた BRDF 計測

4.1 原 理

前章では, BRDF を計測する際の計測時間を短縮する必要性 について述べた.完全な BRDF 計測に時間を必要とするのは, 試料を中心としてカメラや光源を回転する機械的な機構に起因 する部分が大きい.このため,本研究では楕円鏡を用いること でカメラと光源の両方の回転機構を排除して, BRDF を高速に 計測する方法を提案する.

本研究で用いる楕円鏡は,式(1)で定義されるように,Z軸 に垂直な断面が円となる楕円面であり,その内側が全反射する ようにコーティングされているものである.ここで,*a,b* は楕 円鏡のサイズと形状を決めるパラメータである.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1 \tag{1}$$

楕円鏡は2つの焦点を持ち,図2のように,一方の焦点から 出た光は楕円鏡表面で反射し,必ず他方の焦点を通過するとい う特徴を持つ.この特性を利用し,一方の焦点に試料を配置し, 他方の焦点にカメラを配置する.すると試料が放つ全方向への 光は他方の焦点にあるカメラに集まり,1枚の画像として観測 される.つまり,全方向から試料を見た時の反射光を,カメラ を回転させることなく,1枚のみの画像として取得することが 可能となる.

本研究では,楕円鏡とプロジェクタを組合わせることで,照 明方向の変化についても高速化を図る.点光源の代わりにプロ ジェクタを利用し,試料を置いていない方の楕円鏡の焦点にプ ロジェクタの投影中心を配置することで,全方向からの照明を 1台のプロジェクタで代用する.なお,カメラとプロジェクタ の両方を同じ焦点に配置することは物理的に不可能であるため, ハーフミラーを用いて,光学的にカメラとプロジェクタの両方 を同一の焦点に配置し,システム全体の小型化を実現する.焦 点にあるプロジェクタが放つ光は,必ずもう一方の焦点にある 試料に照射される.そのため,プロジェクタがある1点を照ら せば,この光はある方向からの入射光に相当する.この性質を 利用すれば,投影画像を変えることによって,光源を物理的に 回転させることなく光源方向を自由に制御することが可能とな る.投影パターンの更新は,光源の機械的な移動に比べて,は るかに高速であるため,BRDFの高速計測が可能となる.

4.2 計測装置の設計

前節の原理に基づいて設計した計測装置を図3に示す.プロ ジェクタがある1点を照らすと,その投影光は楕円鏡表面の1



図 3 設計した計測装置



点で反射し,対応する光源方向 (θ_i, ϕ_i) から試料を照らす.試料の全方向への反射光は,楕円鏡表面で反射し,1枚の画像としてカメラで撮影される.視線方向 (θ_r, ϕ_r) の反射光強度を知りたい時は,撮影画像の1点を参照すればよい.

4.3 角度と画像座標の関係

光源方向は角度で指定されるのに対し,プロジェクタでは投影画像として表現しなければならない.同様に,視線方向も角度で指定されるのに対し,カメラでは撮影画像として獲得される.そのため,角度と画像座標の関係が必要である.ここで,カメラとプロジェクタの幾何学的キャリブレーション(内部パラメータの推定)ができていれば,それぞれの光軸を楕円鏡の長軸に一致させ,それぞれの光学中心を楕円鏡の焦点に一致させることで,角度と画像座標は容易に変換が可能である.図4(a)は,プロジェクタとカメラの画像座標と光源方向(θ_i, ϕ_i),視線方向(θ_r, ϕ_r)の対応を示している.

なお,各光源方向に対応する1画素のみを光らせても,十 分な光量が得られないため,完全な点光源ではなく,ある程度 の立体角を持った光源にすべきである.しかし,投影画像にお ける1画素に対応する光源の立体角は,各方向ごとに異なる. そこで,試料に対する光源の放射輝度を一定とするために,図 4(b)のような,与えられた光源方向との角度差が閾値以内とな る画素を白とし,それ以外の画素を黒とした投影パターンを用 意する.これにより,試料から見た場合の光源の立体角は,方 向に依存せずに一定となる.



図 5 長軸端に穴の空いた楕円鏡

5. 欠損データの補完

5.1 楕円鏡の穴によるデータ欠損

前章では楕円鏡を用いることで光源やカメラを機械的に回転 させずに全光源方向,全視線方向に対応する反射率を計測する 方法を述べた.しかし,一般に楕円鏡の長軸端付近は高精度に 加工することが困難であるため,市販の楕円鏡には図5のよう に長軸端に穴が空いていることが多い^(注1).穴の空いた楕円鏡 を用いると一部の光源方向から照明することができず,また光 源方向に関わらず一部の視線方向への反射光を観測することが できないため,データの一部が欠損してしまう.そのため,計 測された BRDF は不完全なものとなってしまう.

5.2 データ補完の基本原理

楕円鏡の穴によるデータ欠損は比較的広範囲で起きてしまう ため,周囲のデータから線形補間などによって値を予測して埋 めることは難しい.そこで本研究ではデータが欠損する方向を 変化させて計測した複数のデータを統合することにより,精度 を落とすことなくデータを補完する方法を考える.

データ欠損の原因である穴を物理的に移動させることはでき ないが,試料の向きを変えることによりデータが欠損する方向 を相対的に変えることはできる.つまり,試料を傾ける角度を 変えてデータを計測すれば欠損方向の異なる複数のデータが得 られる.

図6は試料を傾けて配置し,法線方向を軸に試料を回転させ 複数回計測を行うことにより,欠損データを補完する手順を図 示したものである.まず,試料を傾けて配置し照明可能なすべ ての光源方向について計測する(図6上段).試料を傾けて配 置すると,画像は図6(b)のように歪んで計測されるため,図 4(a)に示した角度分布となるように画像を変換する(図6(c)). 次に試料を法線を軸に回転させ,同じく照明可能な全ての光源 方向について計測する(図6下段).2回目の計測ではデータが 欠損している部分が異なるため,統合することにより計測範囲 を拡大することができる.

5.3 必要な撮影回数

本節では,欠損のない完全な BRDF を計測するために必要

⁽注1):仮に穴の空いていない楕円鏡を特別に製作したとしても加工精度が低いため,信頼性の高いデータが得られない.



Lighting direction





図8 欠損方向

な撮影回数について検討する.照明と観測のいずれか一方のみ でデータが欠損するのであれば,欠損方向を変化させて2度計 測するだけで全データを補完できる.しかし,楕円鏡の穴のよ うに照明と観測の両方が欠損する場合はそれらの組み合わせを 考慮しなければならない.

図 7 は図 6(c) のように座標変換した画像を各光源方向につい て横に並べたものである.1度目と2度目の計測(図 7(a)(b)) では各光源方向について撮影された画像のうち一部の視線方向



図 9 シミュレーション方法

についてはデータが欠損している.また,一部の光源方向については照明することができないため全視線方向のデータが欠損している.ここで図8に示すように光源方向ベクトルを*i*,視線方向ベクトルを*r*,全視線方向,全光源方向のうち1回目の計測で穴により照明,観測できない方向ベクトルの集合を*L*¹と定義すると,1回目の計測でデータが欠損する条件は

$$i \in L^1 \lor r \in L^1 \tag{2}$$

と表すことができる.同様に2回目の計測で照明,観測できない方向ベクトルの集合を L^2 (ただし $L^1 \cap L^2 = \emptyset$)とすると, 欠損データ部は

$$i \in L^2 \lor r \in L^2 \tag{3}$$

となる.合計2回の計測で得たデータを統合すると

$$(i \in L^{1} \lor r \in L^{1}) \land (i \in L^{2} \lor r \in L^{2})$$
$$\Rightarrow i \in L^{1} \land r \in L^{2} \lor i \in L^{2} \land r \in L^{1} \quad (4)$$

となり依然として一部のデータが欠損していることがわかる (図 7(c)).そこでさらに照明,観測できない方向ベクトルの集 合を L^3 (ただし $L^3 \cap L^1 = \emptyset$, $L^3 \cap L^2 = \emptyset$)として 3 回目の計 測を行う.3回目の計測では全光源方向について撮影を行う必 要はなく.データ欠損が起きた光源方向,つまり $i \in L^1$ の範 囲と $i \in L^2$ の範囲のみ照明し撮影すればよい(図 7(d)).合計 3回のデータを統合するとデータ欠損の範囲はなくなり,ここ ではじめて完全な BRDF を計測することができる(図 7(e)).

6. 実 験

6.1 シミュレーション

提案手法をもとに反射特性の計測を行う際に,光源方向と視 点方向の4パラメータ $(\theta_i, \phi_i, \theta_r, \phi_r)$ のサンプリング間隔を小 さくすれば,より密なデータが得られるが,サンプリング間隔 の二乗に反比例してデータ容量は増加し,計測時間も長くなっ



(c) 2 反列の(8100 枚)
 (d) 5 反列の(1250 枚)
 図 10 光源サンプリング間隔を変えてレンダリングした結果



図 11 光源サンプリング間隔と PSNR の関係

てしまう.そのため,光源方向のサンプリング間隔に相当する 画像枚数と,視点方向のサンプリング間隔に相当する画像サイ ズを,それぞれどれくらいにすれば十分であるかを事前に調べ る必要がある.

そこで,実際に計測する前に,サンプリング間隔とデータの 精度の関係を調べるためのシミュレーション実験を行った.異 方性反射を表現できるパラメトリック表現モデルとして,式(5) に示す Ward の異方性反射モデルを用いた.

$$\rho(\theta_i, \phi_i; \theta_r, \phi_r) = \frac{\rho_d}{\pi} + \frac{\rho_s}{4\pi\alpha_x \alpha_y \sqrt{\cos\theta_i \cos\theta_r}} e^{-tan^2\theta_h(\frac{\cos^2\phi_h}{\alpha_x^2} + \frac{\sin^2\phi_h}{\alpha_y^2})}$$
(5)

ここで, ρ_d , ρ_s は拡散反射と鏡面反射の反射率, α_x , α_y は鏡面反射の広がりを表す標準偏差である.異方性反射を持つように, α_x , α_y はそれぞれ 0.05,0.16 とした.この値は,[9]において,圧延真鍮の反射特性として記されているものである.

図9に,シミュレーションによる画像品質の比較方法を示す. (a)は,式(5)により定義された反射モデルを用いて,波形の 板をレンダリングした結果であり,これが正解となる.一方, (b)は,提案装置で撮影されるであろう画像を,レイトレーシ ングによって計算した同じ反射モデルのシミュレーション画像 である.(c)は,シミュレーション画像に基づいて,波形の板 をレンダリングした結果である.(a)と(c)を比較することで, サンプリング間隔の影響を調べることができる.

まず,視点方向のサンプリング間隔に相当する画像サイズを 360 × 360 に固定し,光源方向のサンプリング間隔を変化させた.図10 は, θ_i , ϕ_i の間隔を 0.5 度,1 度,2 度,5 度とした場合のシミュレーション画像から波形の板をレンダリングした例である.この結果からも,サンプリング間隔が広くなると,特に鏡面反射の再現性が低下していることがわかる.

画質の違いを定量的に評価するために,Y,Cb,Cr それぞれ について PSNR(Peak Signal to Noise Ratio)を計算した.図 11 は,光源方向を 0.5 度から 5 度まで 0.5 度刻みでサンプリ ングした場合の,PSNR(左縦軸)と画像枚数(右縦軸)を表し ている.サンプリング間隔を広くしても,色そのものが変化す るわけではないため,Cb,Cr に関しては安定して再現性が高 い.一方,Y に関してはサンプリング間隔が広がるにつれて精 度が落ちている.これは鏡面反射付近で特に反射率が劇的に変 化する場合の明暗を正しく再現できていないことによると考え られる.

ー般に,画質評価においては PSNR が 40dB 以上であれば 2 つの画像は見分けがつかないと言われており,この予備実験で Y,Cb,Cr すべてで PSNR が 40dB を越えたのはサンプリン グ間隔が 1 度以下の時であった.そのため,本研究では 1 度を ひとつの目安として捉え,次節での実機による実験においても, 光源のサンプリング間隔を 1 度とする.

次に光源方向のサンプリング間隔を1度に固定して,視点 方向に相当する画像サイズを変化させた.図12はそれぞれ 384×384 , 192×192 , 48×48 , 12×12 サイズのシミュレー ション画像を元に波形の板をレンダリングした結果である.な お,視点方向と画像座標の関係は楕円鏡のパラメータによって 左右され,また図4のように ϕ_r ごとに θ_r の密度が異なるた め,角度は等間隔ではない.

画像サイズを 384 × 384 から 12 × 12 の間の 6 つのサイズ に変えたときの, PSNR の変化を図 13 に示す.このグラフで は,横軸を対数スケールで示している.48 × 48 と粗い画像で も PSNR は 40dBを越えているが,これは波形の板が視点方向 について密な BRDFを必要としない形状をしているためであ ると考えられる.この結果はシーンの形状に依存するため,一 概には言えないが,通常の VGA(640 × 480) 程度のカメラで十 分であることがわかる.

再現性は, 仮定した対象物体の反射モデル, レンダリング時 に仮定した形状・光源方向・撮影方法に依存するため, 必要な サンプリング間隔を厳密に見積もるためには,より多くの検証 データが必要である.この問題は,光源位置の最適配置問題と あわせて今後の課題としたい.

6.2 試作装置

図 14 は提案手法に基づいて作成した計測装置 RCG (Rapid Catadioptric Gonioreflectometer) である. IEEE1394 デジタ ルカメラとして PointGrey 製の Flea を,液晶プロジェクタと

266



図 12 シミュレーション画像サイズを変えてレンダリングした結果



図 13 シミュレーション画像サイズと PSNR の関係



図 14 試作装置: RCG

して EPSON 製の EMP-760 を,楕円鏡としてメレスグリオ製 の楕円体リフレクターを用いた.この楕円鏡では長軸端付近は 切り取られており, $0 \le \theta_i, \theta_r \le 27$ のデータを得ることができ ない.なお,試料は長軸端点の穴を利用して楕円鏡の後ろから ピアノ線を用いて焦点位置に配置している.ピアノ線も一部の





(a) ベルベッド(b) サテン図 15 計測対象とした試料





(a) ベルベッド図 16 撮影画像の例

(b) サテン

データを欠落させてしまうが,ピアノ線は細く,その位置は事 前にわかっているため,周囲のデータから補完しても影響は少 ないと考えられる.

6.3 布の BRDF 計測

図 15 に示すような異方性反射特性を持つベルベットとサテ ンを対象として,実際に試作装置を用いて BRDF を計測し, データ計測時間を調べた.6.1 節での予備実験に基づき,光源 のサンプリング間隔は1度とした.本実験では計測は1回のみ とし,欠損データの補完はしていない.図 16 は,それぞれプ ロジェクタを用いて $\theta_i = 250, \phi_i = 30$ の方向からベルベット, サテンを照射したときの撮影画像である.このような画像を, 合計 $360 \times 90 = 32400$ 枚撮影した.1枚あたりの撮影時間は約 0.18 秒であり,合計の測定時間は約 50分であった.計測時間 の大半を,画像のディスク書き込みと投影パターンの読み込み が占めている.

図 17 は, 光源方向 (θ_i, ϕ_i) を (30,0), (30,45), (30,90)と設定した場合のそれぞれについて, 視点方向である θ_r を 30 度に固定して ϕ_r を 0 度から 360 度まで変化させたときのベルベットの反射光強度を示したものである.それぞれ, 正反射方向で鏡面反射のピークが検出されているが, 分布の形状が異なっていることがわかる.相対角度 $(\phi_r - \phi_i)$ が同じでも反射特性が異なる異方性反射の特徴がよく現れている.

図 18,図 19 は RCG より計測したベルベット,サテンの BRDF をもとに波形の板をそれぞれ2つの光源環境下でレン ダリングしたものである.このシーンでは,偶然に視点と光源 が法線方向にならなかったため,データ欠損の問題は生じてい ない.アライメントの精度が悪かったことやダイナミックレン ジが十分に足りていないことなどが原因となり,布の質感が完 全に再現できたとは言いがたいが,異方性反射が表現できてい ることがわかる.



図 17 光源固定時の反射光強度の分布



図 18 ベルベットのレンダリング結果



図 19 サテンのレンダリング結果 ま 1 堤影ね物との場変

役 Ⅰ 卸於収敛 ⊂ 人損平			
	1st	1st+2nd	1st+2nd+3rd
撮影枚数	29034	58068	64800
照明方向の欠損率	10.39%	0%	0%
BRDF の欠損率	19.70%	0.08%	0%

6.4 撮影枚数と欠損データの関係

データ欠損を補完するために必要な撮影枚数とデータの欠損 率の関係をシミュレーション実験により算出した.表1は実際 にRCGで用いた楕円鏡の形状に基づいて光源方向を1度刻み に変化させた場合の欠損率を計算した結果である.それぞれの 計測では,穴により照明することができない光源方向や,既に 全視線方向について観測済みの光源方向については計測を行わ ないものとする.

1回目の計測で9割近くの光源方向から照明することができる が,観測された各画像にも一部データ欠損があるため,BRDF として計測できるデータは全体の8割程度となる.2回目の計 測データを統合するとすべての光源方向から照明したデータが 得られるが,一部の光源方向については視線方向に関してデー タ欠損が起きるため,わずかではあるが依然として計測できて いないデータがあり,3回目の計測が必要となる.3回目の計 測では1回目もしくは2回目に照明できなかった光源方向の み照明すればよく,撮影枚数は1回目,2回目に対して少なく なった.

7. 今後の課題

本稿では,楕円鏡とプロジェクタを組み合わせることで,物 体表面の反射特性を表す双方向反射率分布関数を高速に計測で きる装置を提案した.提案装置は,サテンやベルベットなどの 布の異方性反射特性も計測が可能であり,計測時間の大幅な短 縮に成功した.ただし,依然として約50分の時間を要してい るため,高速度カメラと組み合わせるなどのハードウェアの工 夫と,サンプリング間隔を反射率の変化にあわせて方向ごとに 可変にするなどのソフトウェアの工夫によって,さらなる高速 化を目指す.

本稿では BRDF を計測したが, 試料を平行移動しながら計 測を繰り返すことにより, 双方向テクスチャ関数 (BTF) の計 測装置として発展することも十分に考えられる.これについて も装置を改良し,有用性を実証していきたい.また,データ量 の問題については,本論文ではまったく取り扱わなかったが, 反射特性にあわせた効率的な記録方法も必要である.今後は, これらの問題を解決し,実用化を進めていく予定である.

なお,本研究の一部は科学研究費補助金(課題番号 17680018) による.

文 献

- B.T.Phong, "Illumination for Computer Generated Pictures", Commun. ACM, vol.18, pp.311-317, 1975.
- [2] K.E.Torrance, and E.M.Sparrow, "Theory for off-specular reflection from roughened surface", J. Opt. Soc. Am, vol.57, pp.1105-1114,1967.
- [3] Y.Sato, M.Wheeler and K.Ikeuchi, "Object Shape and Reflectance Modeling from Observation", SIGGRAPH'97, pp.379-387, 1997.
- [4] 町田貴史,竹村治雄,横矢直和,"複数の照明条件の組合せによる物体の表面反射特性の密な推定",信学論 D-II Vol. J84-D-II, No.8, pp.1873-1881, 2001.
- [5] P.Debevec, T.Hawkins, C.Tchou, H.P.Duiker, W.Sarokin, and M.Sagar, "Acquiring the Reflectance Field of a Human Face", SIGGRAPH2000, pp.145-156, 2000.
- [6] T.Hawkins, J.Cohen, and P.Debevec, "A Photometric Approach to Digitizing Cultural Artifacts", VAST, 2001
- [7] A.Wenger, A.Gardner, C.Tchou, J.Unger, T.Hawkins, and P.Debevec, "Performance Relighting and Reflectance Transformation with Time-Multiplexed Illumination", SIG-GRAPH2005, pp.756-764, 2005
- [8] 武田祐樹,フィンクァンフイヴィエト,坂口嘉之,田中弘美"フレ ネル項を考慮した多視点画像の反射光解析に基づく織布の異方性 反射モデリング",画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2005), pp.1582-1589,2005
- [9] G.J.Ward, "Measuring and Modeling anisotropic reflection", SIGGRAPH'92, pp255-272. 1992
- [10] K.J.Dana, "BRDF/BTF Measurement Device", Proc. International Conference on Computer Vision (ICCV2001), Vol.2, pp.460-466, 2001.
- [11] J.Y.Han and K.Perlin, "Measuring Bidirectional Texture Reflectance with a Kaleidoscope", ACM Transactions on Graphics, Vol.22, No.3, pp.741-748, 2003.